

тельно заряженной вакансии и дивакансии искажения фононного спектра кристалла $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, совпадают. Все квазилокальные колебания анизотропны. Это позволяет осуществить экспериментальную проверку полученных данных. В работе [2] в спектрах КР монокристаллов $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, при $6.61 \leq x \leq 6.79$ обнаружена дополнительная полоса около 6.9 ТГц, имеющая аномальную температурную зависимость. Кроме того, аналогичная полоса в спектре КР наблюдалась в геометрии (xx) [3]. В спектрах ИК нестехиометрических образцов $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, зарегистрирована дополнительная полоса на частоте ~ 6.6 ТГц [3].

Все рассчитанные нами частоты квазилокальных колебаний в оптической части спектра группируются в области от 5.5 до 9.1 ТГц. Учитывая, что в спектрах КР дополнительная мода на частоте 6.9 ТГц наблюдается в геометрии (xx) , можно сделать вывод о связи этого колебания с одиночными вакансиями и дивакансиями с локализацией на них части электронной плотности. Расхождение результатов расчетов с экспериментом обусловлено приближениями модели жестких ионов, а также пренебрежением релаксацией решетки.

Список литературы

- [1] International Tables for X-Ray Crystallography. V. 1. Birmingham, Kynock Press, 1952. P. 558.
- [2] Поносов Ю. С., Болотин Г. А., Гурин О. В., Чеботаев Н. М., Самохвалов А. А., Наумов С. В. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 48. № 7. С. 380—383.
- [3] Feile R. // Physica C. 1989. V. 159. N 1. P. 1—32.
- [4] Мазуренко В. Г., Кортов В. С. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 10. С. 3034—3037.
- [5] Паршин П. П., Землянов М. Г., Парфенов О. Е., Чернышев А. А. // Письма в ЖЭТФ. 1990. Т. 51. № 7. С. 380—382.

Уральский политехнический институт
им. С. М. Кирова
Свердловск

Поступило в Редакцию
25 февраля 1991 г.

УДК 539.219.3

© Физика твердого тела, том 33, № 8, 1991
Solid State Physics, vol. 33, N 8, 1991

ВОЛНА ДЕФОРМАЦИИ СДВИГА ПРИ ДИФФУЗИОННОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ АТОМА ПО РЕШЕТКЕ

B. B. Мещеряков

В недавних работах [1, 2] вновь обсуждаются вопросы о роли упругих деформаций решетки при диффузии атомов и, как следствие, о сдвиговой неустойчивости реальных кристаллов при высоких температурах. В связи с этим возникает необходимость решения динамической задачи о возмущении решетки единичным диффузионным пробегом атома.

Возмущением в этой задаче является плотность силы $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$, действующей на решетку со стороны диффундирующего атома. Полагая, что характерная область движения атома $r(t) \ll r$ — расстояния до точки наблюдения, представим $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ мультипольным разложением

$$F_i(\mathbf{r}, t) = f_i(t) \delta(\mathbf{r}) - P_{in}(t) \partial_n \delta(\mathbf{r}). \quad (1)$$

Монопольная и дипольная составляющие (1) определяются силой $\mathbf{f}(t) = m d_r^2 \mathbf{r}(t)$, где m — масса атома, и силовой диадой $\mathbf{P}(t) = [\mathbf{f}_0 + \mathbf{f}(t)] \times \times [\mathbf{r}_0 + \mathbf{r}(t)]$. Постоянные векторы \mathbf{f}_0 и \mathbf{r}_0 характеризуют начальное состояние решетки ($\mathbf{f}_0 \times \mathbf{r}_0 = 0$) и определяют тензор статических силовых диполей

P_0 [3], который имеет вид диады $f_0 \cdot r_0$ и описывает поле упругой деформации вакансии.

Плотность силы $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ исключает физическое перемещение монополей в пространстве, что приводит к независимости динамики деформирования решетки от начальной статической деформации типа сдвига. Тем не менее структура возмущения (1) достаточно сложна, чтобы оправдать попытку качественной оценки отклика решетки в модели сплошной среды

$$\rho_0 \partial_t^2 s_i(\mathbf{r}, t) = H_{ik, mn} \partial_m \partial_n \partial_k s_k(\mathbf{r}, t) + F_i(\mathbf{r}, t), \quad (2)$$

где ρ_0 — плотность, $H_{ik, mn}$ — тензор Хуанга. Если $\mathbf{f}(0)=0$, то уравнения (2) принимают правильный вид статической задачи с тензором P_0 [3].

В приближении $H_{ik, mn} = c_{44} \delta_{ik} + (c_{11} - c_{44}) \delta_{ikmn}$, где c_{11} и c_{44} — упругие постоянные, определяющие продольную $c_l = (c_{11}/\rho_0)^{1/2}$ и поперечную $c_t = (c_{44}/\rho_0)^{1/2}$ скорости распространения деформаций, решение уравнений (2) можно найти, если воспользоваться разложением запаздывающего интеграла по малому параметру $x(\tau)/c_t \tau$, где $x(\tau)$ и τ — длина и время пробега атома.

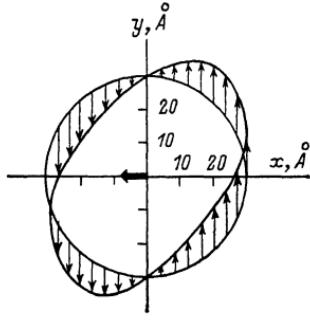


Рис. 1. Деформации сдвига при $\xi=0.82$ ($T=100$ К).

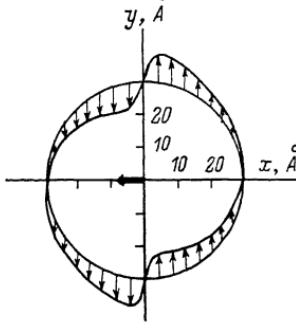


Рис. 2. Деформации сдвига при $\xi=0.2$.

Задание кинематики атома, не противоречащей условию статического равновесия решетки на концах интервала τ , определяет структуру поля смещений в волновой зоне. Например,

$$s_y = \frac{f_0 f_m (1 - \cos \omega_m t')}{4\pi \omega_m c_t c_{44}} \frac{\xi x}{r^2}, \quad (3)$$

где $\xi = (c_{44}/c_{11})^{1/2}$, $t' = t - r/c_t$, $r = (x^2 + \xi^2 y^2 + z^2)^{1/2}$.

Из (3) следует, что если в момент времени $t=0$ атом начал движение, то через время $t_0 = r/c_t$ в точке r возникает смещение среды, которое в силу нечетности относительно координаты x имеет пространственное распределение, соответствующее волне сдвига. Длится процесс от момента времени r/c_t до $r/c_t + \tau$.

Физической причиной, обуславливающей волну сдвига, является перенос начального упругого поля вакансии по решетке, который определяется сдвиговыми компонентами диад $f_0 \cdot r(t)$ и $f(t) \cdot r_0$.

Помимо (3) решение уравнений (2) содержит монопольную волну, обусловленную первым слагаемым (1), и дипольную объемную волну, определяемую тензором $f(t) \cdot r(t)$.

Поля деформации, вычисленные для волновой зоны, убывают с расстоянием по закону r^{-1} , что приводит к конечной величине интенсивности упругого излучения на бесконечности и позволяет рассмотреть начальный период диффузационного акта как процесс поглощения энергии волны решетки. В таком подходе энергия активации самодиффузии складывается из энергий, соответствующих различному типу волн: $E = E_{kin} + E_{vol} + E_{dis}$, где энергия E_{kin} обусловлена изменением кинетической энергии атома, E_{vol} и E_{dis} — изменением дипольного момента решетки.

Параметры смещений (3): ω_m , f_0 и f_m можно оценить приближенно на основании законов сохранения энергии и того обстоятельства, что объемный эффект статического дефекта определяется в основном электростатикой решетки [4]. Это приводит к значениям $\omega_m = (16c_t c_{44}/m)^{1/2}$, $f_0 = mc_t \omega_m$, $f_m = 0.35mc_t \omega_m$.

Вычисления, выполненные для Na, дают следующие результаты: длина волны поглощения $\lambda = 8.6 \text{ \AA}$; максимальная скорость атома $v(\tau) = 0.7 c_t$; длина пробега, соответствующая максимальной скорости атома, $x(\tau) = 1.5 \text{ \AA}$.

На рис. 1, 2 показаны значения $s_y \cdot 10^2$ в 30 \AA от диффундирующего атома, вычисленные по формуле (3) при $\omega_m t' = \pi/2$. Стрелкой в начале координат обозначена сила $f(t)$. Рис. 1 иллюстрирует мгновенную структуру поля сдвиговой деформации для $\xi = 0.82$, что имеет место при $T = 100 \text{ K}$ [5]. С повышением температуры упругая постоянная c_{44} уменьшается быстрее, чем c_{11} , и, например, при $\xi = 0.2$ возможно развитие сдвиговой неустойчивости (рис. 2).

Потенциальная энергия смещений (3) определяется величиной E_{dis} , нижней границей которой является энергия релаксации статической решетки, содержащей вакансию. Например, для щелочных металлов $E_{\text{rel}} = -0.03 \pm 0.04 \text{ эВ}$ [6].

Список литературы

- [1] Manning J. R. // Diffus. Anal. and Appl.: Proc. Sump. TMS Fall Meet. Chicago, 1989. P. 3—17.
- [2] Akbar S. A., Sato H. // J. Phys. and Chem. Solids. 1989. 50. № 7. P. 729—733.
- [3] Лейбфрид Г., Бройер Н. Точечные дефекты в металлах. М., 1981. 439 с.
- [4] Мещеряков В. В. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 1. С. 77—82.
- [5] Landolt-Bornstein H. Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik. Gr. III, B 11. 1979. 854 p.
- [6] Братковский А. М., Зейн И. Е. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 9. С. 2561—2569.

Московский институт стали и сплавов

Поступило в Редакцию
27 февраля 1991 г.

УДК 537.311.3

© Физика твердого тела, том 33, № 8, 1991
Solid State Physics, vol. 33, N 8, 1991

ОПТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ МОДЫ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ GaAs и InAs

Ю. А. Пусеп, А. Г. Милёхин, М. П. Синюков

Измерение отражения двухатомных кристаллов в области полосы остаточных лучей позволяет определить частоты продольных и поперечных оптических фононов ν_{LO} и ν_{TO} соответственно. По виду спектров отражения можно установить характер наблюдаемых колебаний: поперечные колебания соответствуют максимумам отражения, а продольные — минимумам. Вследствие резонансного характера поглощения электромагнитного излучения на частоте поперечных колебаний их наблюдение возможно в достаточно тонких пленках (даже когда толщина пленки $d \ll \ll \lambda/n$, где λ — длина электромагнитной волны, n — коэффициент преломления), в то время как обнаружение продольных колебаний из-за слабого поглощения вблизи частоты ν_{LO} оказывается затруднительным. Вместе с тем именно продольные колебания, такие как плазменные и плазмон-фононные моды, несут информацию о электрофизических свойствах полупроводниковых пленок.